

Caratteristiche microscopio

1. Microscopio elettronico a scansione SEM ad alta risoluzione con sorgente di emissione di campo di tipo Schottky termoassistita, in alto vuoto
2. Colonna elettronica con tecnologia di decelerazione del fascio interna alla colonna stessa con lente combinata elettrostatica/magnetica e senza campi magnetici esterni
3. Tensione di accelerazione, senza polarizzazione del tavolino portacampioni: da 50V a 30kV
4. Massima corrente di fascio: non inferiore a 400nA
5. Risoluzione calcolata con metodo statistico 75:25: < 1nm a 15kV e 1,4nm a 1kV misurate con rivelatore in-column/in-lens/in-beam
6. Ingrandimento massimo dell'immagine SEM a monitor (no formato Polaroid): non inferiore a 2.000.000X
7. Ingrandimento minimo dell'immagine SEM a monitor (no formato Polaroid): < a 3X
8. Rivelatore di elettroni secondari in camera ET-SE
9. Rivelatore di elettroni retrodiffusi BSE in camera retraibile e motorizzato
10. Rivelatore di elettroni secondari in-column/in-lens/in-beam coassiale al fascio elettronico
11. Rivelatore di elettroni retrodiffusi in colonna con filtro di energia fino a 4kV e non coassiale a fascio primario (Mid Angle BSE)
12. Rivelatore per catodoluminescenza retraibile e motorizzato con intervallo spettrale da 350 a 650 nm
13. Dispositivo di decelerazione del fascio primario tramite polarizzazione del tavolino portacampioni incluso
14. Tempo minimo di residenza su pixel: 20ns
15. N. 8 canali acquisibili simultaneamente
16. Camera con diametro interno (o diagonale) non inferiore a 230 mm.
17. Tavolino compucentrico motorizzato su 5 assi, con movimenti X+Y non inferiori a 140 mm e non inferiori a 49 mm su Z. Intervallo di tilt compreso tra -80° e + 80°
18. Numero minimo di porte per accessori: almeno 12
19. Decontaminatore al plasma integrato in camera per rimozione residui organici/carboniosi
20. Misuratore della corrente indotta sul campione
21. Sistema di acquisizione/salvataggio delle immagini di almeno 15k X 15k pixels
22. Software di gestione dello strumento e di elaborazione/processazione delle immagini
23. Software per la navigazione del campione a partire da una immagine ottica dello stesso
24. Rendering 3D attivo basato su tecnologia CAD con misure reali di camera, portacampioni e detectors dotato di interlock di movimenti predittivi.
25. Telecamera CCD per la visualizzazione del tavolino portacampioni
26. Computer di gestione del SEM con doppio monitor LCD
27. Misuratore di corrente di campione e touch alarm inclusi
28. Diagnostica da remoto
29. Compressore dedicato e box di insonorizzazione
30. Sistema UPS integrato nel SEM
31. Microanalisi EDX con rivelatore SDD da 170mm² e risoluzione di 127eV alla MnKa
32. Software inclusi nel sistema EDX: Identificazione di Picco, Mappatura, Scansione di linea,

Mappatura chimica di tipo Live in tempo reale, Analisi quantitative con campioni standard dell'utente, Visualizzazione in una singola immagine di fasi e di distribuzione elementare, Mappatura con correzione automatica degli artefatti, Correzione predittiva e reattiva delle derive, Identificazione e mappatura delle fasi presenti nelle zone analizzate, Mappatura quantitativa, Mappatura di aree grandi

33. PC e monitor dedicati al sistema EDX

34. Installazione, consegna e training (minimo 5 gg) inclusi

35. Garanzia di 24 mesi su tutto il pacchetto proposto (rivelatore EDX escluso)